

受託分析 新サービスのご紹介

最新型 SEM での受託分析が可能になります！

総合理科学機器メーカー JEOL が 70 年余の歴史の中で培った経験と実績、メーカーだからこそ分かる最新の分析技術と高性能装置で、専門スタッフがお客様のサポートをします。

試料作製などのピンポイントサポート、設定時間内であれば試料点数に制限の無い立会観察など、様々なご要望にお答えします。



「JSM-7900F」
の受託分析を5月より開始

弊社ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡のハイエンド装置です。

- ・ EDS 検出器：100mm²（日本電子製）
- ・ 低真空（LV）機能搭載
- ・ EBSD 検出器：Velocity



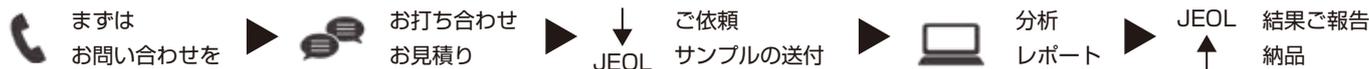
「JSM-IT500HR InTouchScopeTM」
の受託分析を5月より開始

ご好評いただいている弊社汎用型 SEM に高輝度電子銃を搭載した最新型装置です。

- ・ EDS 検出器：100mm²（日本電子製）
- ・ 低真空（LV）機能搭載

主な受託分析装置一覧

TEM、TEM関連装置（EDS、EELS、トモグラフ、歪解析システム、加熱・冷却・液中・非暴露観察システム等の特殊ホルダ、SEM、SEM関連装置（EBSD、加熱ステージ、クライオユニット等）、EPMA、軟X線分光器、XPS、Auger、SPM、FIB、マイクローム（ライカ社製）、イオンスライサ、PIPS（Gatan社製）、クロスセクションポリリッシャ、MS、NMR、 μ CT等



▽ 受託分析の詳細はこちらから

<https://www.jeol.co.jp/support/analysis/>



本社昭島製作所
〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2
TEL:042-543-1111 (大代表) FAX:042-546-3353
www.jeol.co.jp ISO9001・ISO14001 認定取得

受託分析についてのお問い合わせは ...

日本電子株式会社 東京事務所 ソリューション推進室
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-1-1 大手町野村ビル 13 階
TEL : 03-6262-3566